EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

59050939

APPLICANT : HITACHILTD;

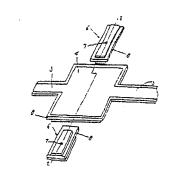
INVENTOR: NAKAZAWA HIROSHI;

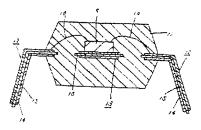
INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT : PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

49 特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭60-195957

⑤Int.Cl.⁴ H 01 L 23/48 識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)10月4日

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

会発明の名称

①出 願

リードフレーム

②特 顧 昭59-50939

太

洋

20出 願 昭59(1984)3月19日

の発明者 谷川 香の発明者 中沢

人

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 髙橋 明夫 外1名

男 油 温

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

- 1. 関面に突出部を設けて成ることを特徴とするリードフレーム。
- 2. 前記リードフレームがブラスチックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの密着性を良くし、対止性のよい樹脂 対止型半導体装置を得ることができるリードフレームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC化実装技術」P137~P150など)。第1図にて、1は半導体チップをマウントするタブ、2はこのタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電極及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ボンディング法などによりボン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法などに より半導体チップやボンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、對止性(耐壓性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チップの大形化に伴ない、對止巾が増々狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その側面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

特開昭60-195957(2)

[発明の目的]

本発明はリードフレームとレジンとの密層(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密層性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂対止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 段付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの湿気等の浸透性異物の侵入 の半導体チップへの到達時間を長くして、封止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

〔寒焼例〕

たに、本発明を実施例に基づき説明する。 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3図は第2図I-I級断面図を示す。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リートフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路案子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路案子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(Aタ)細級により構成される。

横脂封止体11は、例えばエボキシ樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5図は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に複数の緑条の溝部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の樹脂封止体11に埋込まれる長さがが次第に短は出する。そうすると、リード14を折断でできている。そうすると、リード14を折断ではずる。そうすると、リードが必らががある。そうすると、リードがある場合のはでは、リードがゆるみ、リードがにより、より、リードがおいにより、ことになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔劝 果〕

- (1) リードフレームの切断面に段付けを行ない、 個面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密層面積が増大し、 リードフレームとレジンの密層性の向上が図られ る。
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

時開昭60-195957(3)

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施 例に限定されるものではなく、その要旨は途脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも ない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支之ない。又前記実施例では薄部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのバッケージの他、フラットバックタイプのバッケージなど他の樹脂對止型半導体装置にも適用することができ、樹脂對止型半導体装置全般に適用できる。 又電子部品のバッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3図は第2図I-I線断面図、

かつ、側面がフラットである場合に比較して、段が形成されているのでリークパスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への浸透性異のの侵入が遅くなり對止性(耐湿性)が向上する。(3) リードフレームとレジンとの密着性、對止性を衛生を着しく向上により製品寿命を延命し、樹脂對止型きるいとは工事体を置の信頼性を著しているのに、リードフレームとレジンとの密着性の向上の図り、でいるウロ、リードフレームに段間である。

(5) リードフレームの個面に突出部を設けることに加えて、第5回に示すように、リードの上面に 溝部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に躱し、リードがゆるん だり、樹脂封止体の外部に突出したりすることを 防止できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂封止型半導体装置の断面図、

第5図は本発明の他の実施例を示すりードフレ ームの平面図である。

1 …タブ、2 …タブ吊りリード、3 …リード、4 …タブ、5 …タブ吊りリード、6 …リード、7 …樹脂穴、8 …突出部、9 …半導体チップ、10 …コネクタワイヤ、11 …樹脂對止体、12 …リードフレーム、13 …タブ、14 …リード、15 …突出部、16 …棒部。

代理人 弁理士 高 橋 明 夫



